

Programa Institucional de Bolsas  
de Iniciação Científica

24 a 26 outubro de 2012

Pró-Reitoria de Pesquisa - Pibic/CNPq

Pró-Reitoria de Graduação - SAE/ Unicamp



E0567

**DIFRAÇÃO BRAGG-SUPERFÍCIE (BSD) DE RAIOS-X NO ESTUDO DO EFEITO DE ÍONS FE+ IMPLANTADOS EM SI(001)**

Guilherme Calligaris de Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Lisandro Pavie Cardoso (Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP

Ne

Induzida por Feixe de Íons (IBIEC) em substratos de Silício (001) utilizando a Difração Múltipla de Raios-X (XRMD). Esta técnica possui um grande potencial na caracterização estrutural de alta resolução e torna possível obter informação tridimensional sobre a rede cristalina analisada, não disponível por outras técnicas. Além disso, o caso especial da difração múltipla, denominado de difração Bragg-Superfície (BSD), assim como o seu mapeamento (MBSD), foram fundamentais neste projeto para a análise das regiões que apresentam as fases cristalinas dos compostos Fe-Si, logo abaixo da superfície das amostras após o processo IBIEC.

Difração múltipla de raios X - Semicondutores - Implantação iônica